PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-142012

(43) Date of publication of application: 25.05.2001

(51)Int.CI.

G02B 26/10 B41J 2/44 7/00 **GO2B** HO4N

(21)Application number: 11-324640

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

15.11.1999

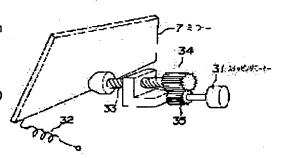
(72)Inventor: KOMODA NOBUTO

(54) OPTICAL SCANNER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To detect and correct fluctuation by simple constitution even when the position of a laser beam is fluctuated in a subscanning direction.

SOLUTION: The reflection angle of a light beam can be adjusted in a direction where the laser beam is moved in the subscanning direction by a mirror 7. A PD unit 11 is provided with a PD 1 arranged in a direction orthogonal to a beam scanning direction and a PD 2 arranged to be inclined by 45° to the beam scanning direction. The PD 1 and the PD 2 detect the deviation of the light beam in the subscanning direction based on the time interval of receiving the light beam, the mirror 7 is turned so that the deviation may be '0' and the deviation in the subscanning direction is eliminated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-142012 (P2001-142012A)

(43)公開日 平成13年5月25日(2001.5.25)

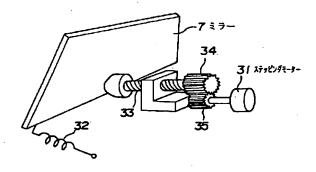
		(10) 2400 E	1 /2420 0 /310 (20000010)
(51) Int.Cl.'		FI	テーマコード(容考)
G02B 26/10		G 0 2 B 26/10	A 2C362
			B 2H043
B41J 2/44		7/00	D 2H045
G02B 7/00		B41J 3/00	D 5C072
H04N 1/113		H 0 4 N 1/04	104A
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	請求項の数3 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特顧平11-32464 0	(71)出顧人 000006747 株式会社リコー	
(22) 出顧日	平成11年11月15日(1999.11.15)	東京都大田区中馬込1丁目3番6号	
	T MIT TIT/110 H (1000: 11:10)	(72)発明者 菰田 宜	
	•		田区中馬込1丁目3番6号 株式
		会社リコ・	
		(74)代理人 100078134	
		· ·	武 顕次郎 (外2名)
•	•	,开程工,	C 18/241 OF2-11/
			自砂室に始え
	• •	·	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光走査装置

(57)【要約】

【課題】 レーザビームの位置が副走査方向に変動して も簡単な構成で変動を検出して補正する。

【解決手段】 ミラー7はレーザビームを副走査方向に移動させる方向に光ビームの反射角の調整可能であり、PDユニット11はビーム走査方向と直交する方向に配置されたPD1と、ビーム走査方向に対して45。傾けて配置されたPD2を有する。PD1、PD2が光ビームを受光する時間間隔に基づいて光ビームの副走査方向のずれ量を検出し、ずれ量が「0」になるようにミラー7を回動させ、副走査方向のずれを解消させる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 光ビームを走査して画像を書き込む光走 査装置において、

主走査方向に偏向される光ビームを走査対象に反射する とともに、光ビームの軸に対して副走査方向に反射角を 調整可能な反射ミラーと、

光ビームの走査方向に対して離間するようにかつ相対的 に斜めに配置された少なくとも2つの受光素子と、

前記2つの受光素子が光ビームを受光する時間間隔に基づいて光ビームの副走査方向のずれ量を検出し、ずれ量 10が「0」になるように前記反射ミラーの反射角を調整する手段と、を備えたことを特徴とする光走査装置。

【請求項2】 前記反射ミラーを基準位置に固定した状態で前記2つの受光素子が光ビームを受光する時間間隔 に基づいて光ビームの副走査方向のずれ量を検出し、前記反射角を調整する手段によって前記ずれ量が「0」に なるように前記反射ミラーを前記基準位置から回動させて反射角を調整することを特徴とする請求項1記載の光走査装置。

【請求項3】 前記光ビームを出射する出射手段が複数 20 個設けられていることを特徴とする請求項1または2記載の光走査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザビームなどのビーム光を走査する光走査装置に係り、例えばプリンタ、複写機、ファクシミリなどの画像形成装置における画像の光書き込みに好適な光走査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】との種の光走査装置では、レーザビームなどのビーム光をポリゴンミラーなどの光偏向手段により主走査方向に偏向させて走査することにより感光体上に潜像を形成する。このような構成では、主走査方向の書き始めの同期をとることが重要であり、この種の同期検知方法として、例えば特開平9-174924号公報、特開平10-297023号公報、特開平10-311959号公報などに提案された方法が知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、レーザダイオード(以下、「LD」と略称する。)書き込み装置などの光走査装置では、温度変化による筐体の歪み、光学部材の熱収縮、ミラーの角度変動などにより、レーザビームが副走査方向に変動するととが知られている。レーザビームが副走査方向に変動すると、レーザビームブリンタやデジタル複写機では画像位置が副走査方向にずれるので、画像位置の精度を向上させるためにビーム位置を調整する必要がある。特に複数のビームにより複数ラインを同時に書き込む装置では、各ビームの副走査方向の位置ずれは重要な問題となる。

【0004】本発明は係る従来例の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、レーザビームの位置が副走査方向に変動しても簡単な構成で変動を検出して補正することができる光走査装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために本発明は、光ビームを走査して画像を書き込む光走査装置において、主走査方向に偏向される光ビームを走査対象に反射するとともに、光ビームの軸に対して副走査方向に反射角を調整可能な反射ミラーと、光ビームの走査方向に対して離間するようにかつ相対的に斜めに配置された少なくとも2つの受光素子と、前記2つの受光素子が光ビームを受光する時間間隔に基づいて光ビームの副走査方向のずれ量を検出し、ずれ量が「0」になるように前記反射ミラーの反射角を調整する手段とを備えていることを特徴とする。

[0006] この場合、前記反射ミラーを基準位置に固定した状態で前記2つの受光素子が光ビームを受光する時間間隔に基づいて光ビームの副走査方向のずれ量を検出し、前記反射角を調整する手段によって前記ずれ量が「0」になるように前記反射ミラーを前記基準位置から回動させて反射角を調整するようにするとよい。

【0007】なお、前記構成は、複数個の光出射手段を設け、光ピームを複数照射して同時に複数の走査を行う所謂マルチピーム方式の光走査装置に特に好適である。 【0008】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態について説明する。

【0009】図1は本発明に係る光走査装置の一実施形態を示す構成図である。同図において、LDユニット1 aは図2のLDユニットを詳細に示す図から分かるように、LD1、コリメートレンズ2、アバーチャ1 bを有し、LD制御板上1 c上に搭載されている。LD1は画像処理部21からメイン制御板22、PWM(パルス幅変調)制御板23上の各回路を介して印加される画像データに応じて変調されたレーザビームを出射する。このレーザビームはシリンダレンズ3を介してポリゴンスキャナ4により主走査方向に等角速度で偏向される。ポリゴンスキャナ4はポリゴンミラーとポリゴンモータを有し、ポリゴンモータの回転はポリゴン制御板24上の回路により制御される。

【0010】ポリゴンスキャナ4により等角速度で偏向されたレーザビームは、f θレンズ5、6により等速度偏向に補正された後、図3に詳しく示すミラー7により反射され、次いで防塵ガラス27を介して感光体10上に走査されるとともに、有効画像領域の手前において同期検知ミラー25により反射されて図4に詳しく示すPD(フォトダイオード)ユニット11により受光される。PDユニット11の検知信号は同期検知ファイバ26を介してメイン制御板22上のCPU(不図示)によ

り取り込まれる。

【0011】ミラー7は図3に詳しく示すように、ステ ッピングモータ31及びバネ32によりレーザビームを 副走査方向に移動させる方向に調整可能である。詳しく は、ミラー7の中央下部を先端が半球状に形成され、軸 部にネジが切られたロッド33により押すと、反射光の 副走査方向の反射角度が変わるように構成されている。 ロッド33の他端にはギア34が設けられており、この ギア34はステッピングモータ31の軸に取り付けられ たギア35と噛合している。バネ32はミラー7をロッ 10 ド33が押す方向と逆方向に付勢している。これによ り、ステッピングモータ31の回転により、軸受に支持 されたロッド33がネジの作用により進出後退し、この 動作に応じてミラー7の副走査方向のビーム反射角の変 更が可能となる。なお、この機構は単なる説明のためで あって、精度を向上させるためには、ギア34、35の ギヤ比を大きくしたり、モータ31として4相、5相な どの髙精度のステッピングモータ31を用いればよい。 【0012】PDユニット11は図4のPDユニットを 詳細に示す図から分かるように、ビーム走査方向と直交 20 求めるようにしてもよい。 する方向に配置されたPD1と、ビーム走査方向に対し て45。傾けて配置されたPD2とを備え、また、PD*

*1がPD2より先にビームを受光するように配置されて いる。PD1、PD2の検知信号はメイン制御板22上 のCPUにより取り込まれ、CPUは図5のフローチャ ートに示すように、PD1、PD2の検知信号に基づい てステッピングモータ31を制御することによりミラー 7を傾動させてレーザビームの光軸を正常位置に傾け

【0013】すなわち、図5に示した処理では、まず、 調整処理をスタートし(ステップS1)、次いでポリゴ ンモータをスタートし (ステップS2)、次いでLD1 を点灯する(ステップS3)。次いでレーザビームがP D1に入射するまで待機し(ステップS4)、PD1に 入射するとカウントを開始し(ステップS5)、次いで レーザビームがPD2に入射するとカウントを停止し (ステップS6)、PD1およびPD2をビームが走査 する速度と、PDIおよびPD2間の初期設定時の基準 距離は既知であるので、次式(1)によりビームの副走 **査方向のずれ量を算出する(ステップS7)。なお、**と のカウント数は、複数ライン分をカウントして平均値を

[0014]

副走査方向のずれ量= (カウント数×ビーム走査速度

-PD1、PD2間の基準距離)×tanθ … (1)

(但し、 $tan\theta = 1$)

※ ※次いで次式(2)

(但し、定数は、ステッピングモータのステップ数とミ ラー7の角度調整量の関係に基づいて予め求められた 値)を求め(ステップS8)、次いでこのステップ数だ けステッピングモータ31を駆動してミラー7を傾け (ステップS9)、次いでこの調整処理を終了する(ス テップS10)。

【0015】 CCで、前記の実施形態では、PD1、P D2間を走査する時間に基づいてビームの副走査方向の ずれ量を検出するので、PD1、PD2の検出信号を主 走査方向の書き始め位置を決定するための同期検知信号 として兼用することができる。

【0016】また、図6に示すようにミラー7の基準位 置を求めるためにマイクロスイッチ、フォトインタラブ タなどのセンサ36を設け、調整スタート時にこの基準 40 位置でずれ量を求め、基準位置からずれ量に応じてミラ -7を回動(角度調整)させるようにしてもよい。な お、ミラー7の基準位置を確認し、ミラー7を回動させ る場合、電源をオフする前にステッピングモータ31の 回転数分だけ逆回転させて、次の電源オン時の調整スタ ート時には常にミラー7が基準位置に位置するようにし てもよい。また、ずれは±方向に存在するので、ミラー 7の基準位置を中心位置にしてもよい。

【0017】また、前記の実施形態では、シングルビー ム方式について説明したが、マルチビーム方式の光走査 50 は、LD1-1、1-2の各ビームがそれぞれコリメー

ステッピングモータのステップ数=ずれ量×定数 …(2) 装置にも適用することができる。図7は一例として、第 1書き込み系と第2書き込み系の2つの書き込み系を有 する2ヒーム方式の光走査装置を示す。この例では、L 30 D1-1、1-2の各ピームがそれぞれコリメートレン ズ2-1、2-2、シリンダレンズ3-1、3-2を介 して共通のポリゴンスキャナ4により主走査方向に等角 速度で偏向される。ポリゴンスキャナ4により等角速度 で偏向された各レーザビームは、それぞれ f θ レンズ5 -1,6-1、5-2,6-2により等速度偏向に補正 された後、ミラー7-1,7-2、ミラー8-1,8-2、ミラー9-1, 9-2により順次反射されて感光体 10上に走査されるとともに、有効画像領域の手前にお いてPDユニット11-1、11-2により受光され

> 【0018】この2ピーム方式の光走査装置では、PD ユニット11-1、11-2により各ピームの副走査方 向のずれ量を検出して、ミラー7-1、7-2、ミラー 8-1、8-2、ミラー9-1、9-2の少なくとも1 つのミラーを回動させ、副走査方向の反射角を調整す る。

> 【0019】また、第1書き込み系と第2書き込み系の 2つの書き込み系を有するマルチビーム方式の光走査装 置として、図8に示すようなものもある。との場合に

トレンズ2-1、2-2、シリンダレンズ3-1、3-2を介して共通のポリゴンスキャナ4により主走査方向 に等角速度で偏向される。ポリゴンスキャナ4により等 角速度で偏向された各レーザビームは、それぞれ $f \theta$ レ ンズ5-1,6-1、5-2,6-2により等速度偏向 に補正された後、ミラー7-1, 7-2、ミラー8-1.8-2により順次反射されて感光体10上に走査さ れるとともに、有効画像領域の手前においてPDユニッ ト11-1、11-2により受光される。

[0020] この2 ビーム方式の光走査装置では、PD 10 ユニット11-1、11-2により各ピームの副走査方 向のずれ量を検出して、ミラー7-1、7-2、ミラー 8-1、8-2の少なくとも1つのミラーを回動させ、 副走査方向の反射角を調整する。

【0021】なお、図7に示した例は、主走査方向を2 分割して1つのラインを2つのビームにより同時に書き 込むように構成した例であり、図8に示した例は主走査 方向の異なる2つのラインを2つのビームにより同時に 書き込むように構成した例である。

[0022]

【発明の効果】以上説明したように請求項1記載の発明 によれば、光ピームの走査方向に対して離間してかつ相 対的に斜めに配置された少なくとも2つの受光素子が光 ビームを受光する時間間隔に基づいて光ビームの副走査 方向のずれ量を検出し、ずれ量が「0」になるように反 射ミラーの反射角を調整するようにしたので、レーザビ ームの位置が副走査方向に変動しても簡単な構成で変動 を検出して補正することができる。

【0023】請求項2記載の発明によれば、反射ミラー を基準位置に固定した状態で2つの受光素子が光ビーム*30 PD1、PD2 フォトダイオード

*を受光する時間間隔に基づいて光ビームの副走査方向の ずれ量を検出し、ずれ量が「0」になるように反射ミラ ーを基準位置から回動させるようにしたので、例えば電 源オン時には毎回、変動を検出して補正することができ

【0024】請求項3記載の発明によれば、マルチビー ム対応に光走査装置において、簡単かつ精度良く副走査 方向のビームずれを修正することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光走査装置の一実施形態を示す構 成図である。

【図2】図1のLDユニットを詳しく示す構成図であ

【図3】図1のミラーの傾動機構を詳しく示す構成図で ある。

【図4】図1のPDユニットを詳しく示す構成図であ

【図5】図1のメイン制御板上のCPUの処理を説明す るためのフローチャートである。

20 【図6】ミラーの基準位置センサを示す構成図である。 【図7】本発明に係る2ビーム方式の光走査装置を示す 構成図である。

【図8】本発明の他の実施形態に係る2ビーム方式の光 走査装置を示す構成図である。

【符号の説明】

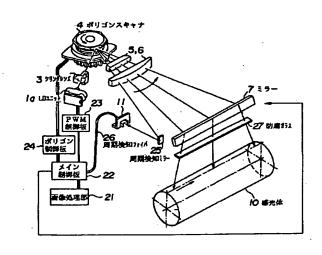
1 LD(レーザダイオード)

7 ミラー

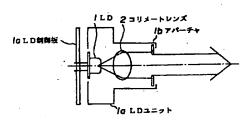
11 LDユニット

31 ステッピングモータ

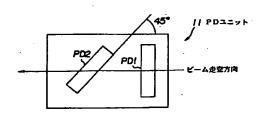
【図1】

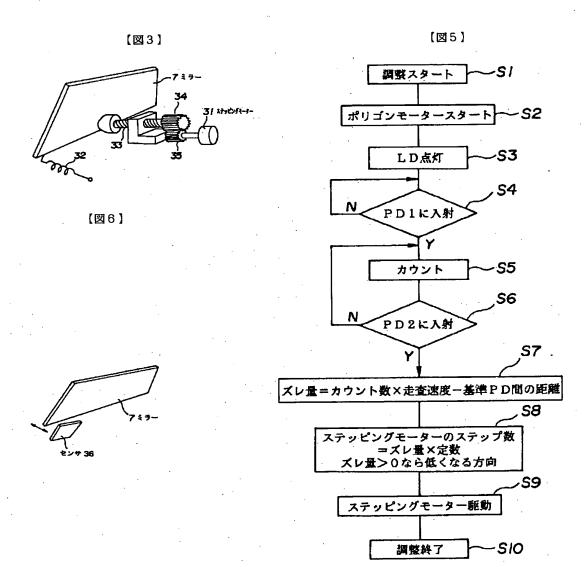


【図2】

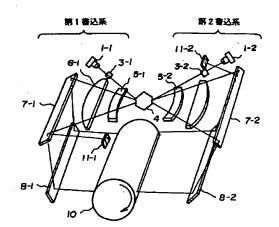


【図4】

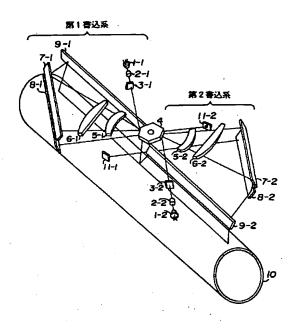




[図8]



【図7】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2C362 BA58 BA61 BA71 BA83 BA87 BB46

2H043 AA02 AA09 AA23

2H045 AA01 BA22 BA33 BA34 CA88

DA02

5C072 AA01 BA13 DA02 DA04 DA23

HA02 HA06 HA09 HA13 HB08

XA01 XA05